

## NanoX-Pert „Oberflächenanalytik zur Fehleranalyse“

**Termin:** 17.10.2023  
9:00 bis 16:30 Uhr

**Ort:** Physical Electronics GmbH  
Salzstraße 8  
85622 Feldkirchen bei München

**Leitung:** Stefan Reichlmaier

**Im Fokus:**  
Oberflächenanalytik zur Fehleranalyse  
mit TOF-SIMS, XPS und Auger

Das Seminar ist kostenlos und beinhaltet Verpflegung und Informationsmaterial. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.  
Vortragssprache ist Deutsch.

**Bitte melden Sie sich [HIER](#) online an.**

Registrierung bis spätestens **01.09.2023**

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir Sie, sich rechtzeitig anzumelden.

Sie können leider nicht teilnehmen?  
Informationen zu weiteren Terminen senden wir Ihnen gerne zu.

Bei Fragen zum Seminar steht Ihnen Frau Martin gerne zur Verfügung.

Monika Martin  
[lab@phi-europe.com](mailto:lab@phi-europe.com)

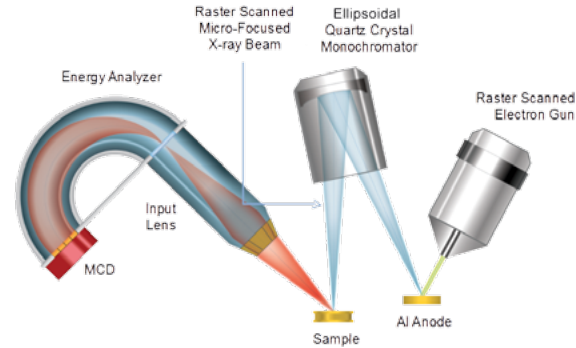
[www.phi-gmbh.eu](http://www.phi-gmbh.eu)

## Die Agenda des Tages

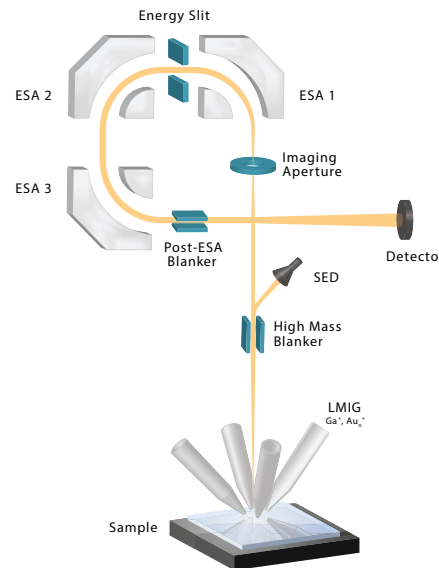
- 09:00 Registrierung
- 09:15 Begrüßung und Einleitung
- 09:20 Anwendungsbeispiele:  
Oberflächenanalytik zur Fehleranalyse  
(TOF-SIMS, XPS, Auger)
- 10:30 **Oberflächenanalysen für  
Silizium-Drift-Detektoren**  
**Herr Dr. Höllt, KETEK GmbH**
- 11:00 Kaffeepause
- 11:15 Vorstellung der Methode TOF-SIMS  
Vorstellung der Methode XPS  
Vorstellung der Methode AES  
Vorstellung weiterer Analysemethoden  
(u.a. LIBS und TEM)
- 12:45 Mittagessen (Buffet)
- 13:30 Praktischer Teil (3 Gruppen á 20 min)  
TOF-SIMS; XPS; Auger und PHI Genesis
- 15:00 Kaffeepause
- 15:15 **Die Messungen sind abgeschlossen:  
Wie geht es weiter?** XPS-Datenauswertung  
**Zu viele Daten? Multivariate Statistik hilft!**  
PCA-Anwendungen mit TOF-SIMS Daten
- 16:00 Zusammenfassung:  
Testmessungsgutschein & Feedback
- 16:15 Möglichkeit zur Diskussion Ihrer  
individuellen Fragestellungen
- 16:30 Ende des Seminars

NEUER  
GAST-  
VORTRAG

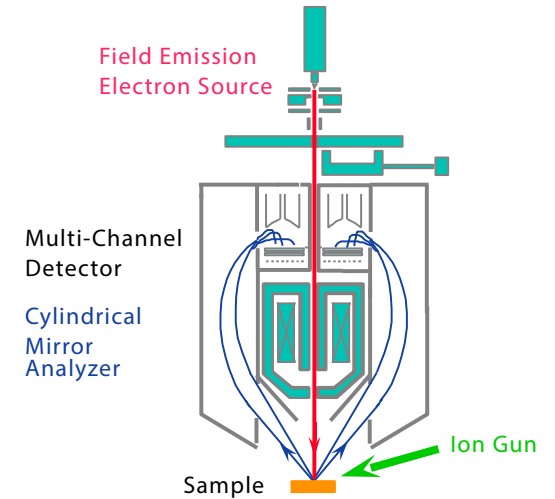
### XPS (Röntgenphotoelektronenspektroskopie)



### TOF-SIMS (Sekundärionenmassenspektrometrie)



### AES (Augerelektronenspektroskopie)



### Zielsetzung

Dieses Seminar gibt einen Überblick über die wichtigsten oberflächenanalytischen Methoden und vermittelt ein Verständnis für deren Anwendung.

### Typische Fragestellungen

- Vergleich gute Probe – schlechte Probe
- Identifizierung der Oberflächenverunreinigung
- Quantifizierung der Oberflächenszusammensetzung

Im Seminar stellen wir Ihnen analytische Nachweisverfahren zur Untersuchung dünner Schichten oder zur Fehleranalyse und Qualitätskontrolle vor.

Freuen Sie sich auf die Darstellung der neuesten Geräteentwicklungen in der Oberflächenanalytik!

Unser Seminar, genau das Richtige für Sie.